

## DMP7000系列

# 光电探测器 PD/APD晶圆测试机台

- PD/APD 晶圆量产测试
- 背照式 晶圆性能测试
- PD/APD 来料检测

## 产品简介

柯泰光芯自主研发的背照式APD晶圆性能测试系统DMP7000，该系统由自动探针台模组、光纤耦合模组、APD测试模组、特制探针座模组、驱动及控制软件等组成，可以作为裸芯片的综合性能评测机构，该系统具备快速半自动综合检测能力，测试速度快，完全符合小批量实验室测试应用，检测精度高，适应性强。

## 性能指标

### 定制探针台

- ☆ 高透光率蓝宝石玻璃载台：透过率90%以上；
- ☆ T轴转动角度： $\pm 7^\circ$ ；
- ☆ 角度分辨率： $0.0007^\circ$ ；
- ☆ 平面度： $\pm 10\mu\text{m}$ ；
- ☆ Z轴行程：10mm；
- ☆ Z轴分辨率：1 $\mu\text{m}$ ；
- ☆ 漏电流： $\leq 1\text{nA}$ 。

### APD分析测试模块

- ☆ APD暗电流测试；
- ☆ APD正向电压测试；
- ☆ APD雪崩电压测试；
- ☆ APD增益测试；
- ☆ APD响应率测试。

